科学研究費助成事業(科学研究費補助金)研究成果報告書

平成 24 年 6 月 12 日現在

為則雄祐(TAMENORI YUSUKE)				
財団法人高輝度光科学研究センター・利用研究促進部門・副主幹研究員				

研究成果の概要(和文):X線を利用した従来の分析手法は、主に4 keV を超える高いX線を 利用してきた。一方で、軽元素のK 殻励起エネルギーに対応する軟X線は、大気中をもほとん ど透過できないことから、その利用は高真空下に制限されてきた。本研究では、2keV以下の 軟X線を大気圧環境下での吸収分光分析に応用することを目指して、大気圧環境下での軟X線 吸収強度検出法の開発を行った。結果、転換電子収量法が非常に有用であることを確認すると ともに、水和物の電子状態を軟X線分光法によって直接観察することに成功した。

研究成果の概要(英文): So far, the application of soft X-ray analysis is highly restricted. Since soft X-rays below 2.0 keV are fairly absorbed in atmospheric air, the standard procedure in a soft X-ray analysis is to install all equipment necessary for experiments inside the high-vacuum chamber. In the present research, we have developed "the ambient pressure soft X-ray photoabsorption spectroscopy" for the observation of electronic and structural properties of matters under the normal atmospheric pressure condition. We have successfully indicated the capabilities of the XAS analysis under the more real environment, and the unique power of this technique to probe significant aspect of chemical reactions.

			(金額単位:円)
	直接経費	間接経費	合 計
2010 年度	1, 700, 000	0	1, 700, 000
2011 年度	700, 000	210, 000	910, 000
年度			
年度			
年度			
総計	2, 400, 000	210, 000	2, 610, 000

交付決定額

研究分野:化学

科研費の分科・細目:複合化学、分析化学 キーワード:軟X線、大気圧、XAFS、蛍光収量法、転換電子収量法

1. 研究開始当初の背景

分析化学の分野では、X線を利用した多彩 な分析手法が活用されている。ところが、そ れらは主に4keVを超える硬X線を利用する。

C,N,O,Si,P,S といった軽元素の K 殻励起エ ネルギーに対応する軟X線は物質に対する透 過力が弱く、大気中をも透過できないことか ら、その利用は超高真空下に限定されてきた。 その結果、測定対象は大幅に制限され、軟X 線の利用は一部の基礎科学的な研究に留ま っている。

しかしながら、透過率の低さは物質との強い相互作用の裏返しでもある。軟 X 線領域に は軽元素のK 殻や、金属元素の L・M 殻吸収 端が密集して存在する。さらに、X 線励起は 元素選択性を有するため、これらの元素を共 鳴励起できる軟 X 線は、軽元素を含む物質の 化学・電子状態観測手段として大きな可能性 を秘めている。

2. 研究の目的

申請者はこれまでに、超音速分子線を開発 した経験を活かして、小型差動排気装置の開 発を行ってきた[1]。真空窓を使用せず、差 動排気を用いることで、軟X線透過率が高い 大気圧ヘリウム環境下に 0.3keV 以下の軟 X 線まで導き出すことに成功している。本研究 では、この技術をさらに発展させ、軟X線吸 収分光法を"大気圧環境下にある実材料"の 分析手法として展開することを目的として、 以下の研究開発を実施した。

(1)電子収量法・蛍光収量法利用した、大 気圧条件下で利用可能な軟X線吸収測定装 置を開発する。

(2) 大気圧環境下で、水和したシリカゲル 中の塩化コバルトの軟 X 線吸収分光測定を行 い、水和試料の電子状態を軟 X 線分光によっ て直接観察する。

多孔質構造を持つシリカゲルは高い吸水 性を有する。吸水した試料を真空中に導入す ると乾燥・脱水が起こるため、従来、軟X線 を用いた分光測定によって、このような試料 の電子状態を分析することは極めて困難で あった。本研究では、これまで軟X線測定対 象として制限されてきた吸水状態にある試 料の電子状態を、軟X線によって初めて観察 することに挑戦した。

3.研究の方法

研究は大型放射光施 SPring-8/BL27SU で実施した。アンジュレータ光源で発生した軟 X線は、回折格子型分光器によって単色化された後、トロイダル鏡によって試料位置に集光した。本研究課題で開発される軟 X線吸収測定装置は、ビームラインの最下流に設置した。また、その直前には差動排気装置を配備し、

大気圧ヘリウム充填された測定槽とビーム ラインは真空窓を用いることなく直接接続 した(図1)。



図1:大気圧環境下軟X線吸収分光装置の概 要

本研究では、転換電子収量法・全電子収量 法・蛍光収量法を用いることで、大気圧環境 下軟 X 線吸収分光測定を行うことを試みた。 全電子・転換電子収量測定においては、試料 全面に配置した金属アノード(0~±500V) によって、試料から放出されるオージェ電子 あるいは光電子を検出した。光路中で生じる 電子やイオン信号によるバックグラウンド を低減するために、検出器にはシールドを付 加した。また、試料ホルダに0~±100Vの電 圧を印可することで、試料ホルダをアノード として利用した試料電流法による電子流量 測定法についても測定を行った。

蛍光収量法では、大気圧ヘリウム環境下で も動作可能な Si PIN フォトダイオード(IRD 社製:AXUV-100)を用いて蛍光 X線を検出し た。その際、可視光の混入を除去するために 検出器全面には 150nmのアルミニウムを蒸着 したものを使用した。

測定では、絶縁物の電子収量測定評価では デマルケスト(A1203・Cr203)板を使用した。 また、水和物の測定においては、インジケー タとして CaCl₂が混入されたシリカゲル(博 洋社製)を使用した。試料はいずれもアルミ ニウム製の試料ホルダ上に導電性両面テー プで固定することで測定容器に導入した。

4. 研究成果

(1) 大気圧環境下での電子収量測定法評価 真空環境下で電子収量法を用いた場合、絶 縁物試料はチャージアップの影響により吸 収スペクトルを得ることができない。しかし ながら、大気圧環境下では雰囲気ガスのイオ ン化によって生じる電子やイオンが、試料表 面上に蓄積した電荷を中和するため、絶縁物 でも電子収量法が適応できる。このことは、 硬X線領域での測定において知られている [2]。同様の測定手法を大気圧環境下におけ る軟X線吸収分光測定おいても適応可能かど うか、まずは試験測定を行った。

最初に、バイアス電圧を印可した金属アノ ード製の検出器を試料前面に配置し、外部に 放出された電子・イオンを検出することで吸 収スペクトルを測定することを試みた。しか しながら、この方法では優位な吸収信号を得 ることができなかった。軟X線領域の光で放 出される光電子はエネルギーが数100eV程度 であるため、ヘリウム雰囲気との相互作用が 強い。したがって、大気圧ヘリウム層を通過 して、検出器まで到達する信号数が少なかっ たものと考えられる。

一方で、試料ホルダをアノードとした試料 電流法では、導電性・絶縁性の両試料に対し て軟X線吸収スペクトルを得ることができた。 その際、バイアス電圧は数十ボルト程度で十 分であり、アノードのバイアス電圧の極性は プラス/マイナスどちらでもほぼ類似のスペ クトルを得ることができた。プラスバイアス の場合は電子を、マイナスバイアスの場合は 放出された光電子やオージェ電子と雰囲気 ヘリウムの衝突による二次イオン化によっ て生成されたヘリウムイオンを、それぞれ検 知していると予想される(転換電子収量法)。

図2に試料電流法ならびに蛍光収量法を 用いて測定したデマルケストの A1-K 殻励起 領域における軟X線吸収スペクトルを示す。 高真空中では帯電によって絶縁物試料の電 子流量測定はできないが、大気圧環境下で測 定を行う事によって帯電が中和され、電子収 量測定を用いた吸収測定が可能となってい る。また、蛍光収量測定に見られるような自 己吸収の影響も見られない。この本研究によ り、フォトダイオードを用いた蛍光収量法と 試料電流法を組み合わせることにより、絶縁 物を含む広範な試料に対して表面とバルク の電子状態を、大気圧ならびに低真空環境下 で同時に観察可能であることが確認された。



図2:大気圧(青)、スクロールポンプ真空下 (緑)で測定した転換電子収量スペクトルと 蛍光収量法(赤)で測定したデータの比較。 蛍光収量法では、自己吸収の影響で1566eV 付近のメインピーク強度が低下しているが、 電子収量法では帯電の影響が緩和されるとと もに自己吸収の影響も無くなり、メインピー クが明瞭に観測されている。

また、試料環境を大気圧まで圧力を高くせ ずとも、スクロールポンプで到達可能な中真 空程度(~1Pa)まで試料環境の圧力を高く することで、絶縁物試料に対しても、帯電の 影響が無いスペクトルを得ることができた (図2:緑)。この結果は、軟X線領域では 電子緩和確率が高いために多くのオージェ 電子が放出されること、ならびに試料周辺を 取り巻くヘリウムや残留気体のイオン化確 率が高くなるために、僅かなバイアスを試料 ホルダに印加するだけで二次イオンを効率 よく生成・補修できるためであると考えられ る。ただし、大気圧ヘリウム環境下で測定し た電子収量法は、中真空条件で測定したスペ クトルと比較して、若干のピーク強度減少が 確認された。この結果は、高い圧力条件下で は電子収量法も自己吸収の影響を受けるこ とを示している。放出された蛍光 X 線の吸収 による二次イオン生成効率が高い圧力条件 で増加しているなどの原因が考えられるが、 詳細についてはさらに検討が必要である。

これら一連の研究により、清浄表面の分析 を行う場合や、酸素・窒素といった残留気体 の影響を受けやすい試料や測定など、超高真 空下での実験を必須とする場合を除いて、ス クロールポンプで到達可能な中真空程度で 実験を行うことにより、絶縁物試料も含めた 幅広い試料に対して、簡便に軟 X 線吸収分光 測定が可能であることが確認された。

(2) 水和試料の電子状態観察

次に、色標示薬として塩化コバルト (CaC12)を含有したシリカゲルを対象とし、 コバルトの L₂₃ 吸収端において吸収分光測定 を行った。塩化コバルト結晶は、無水状態で は鮮やかな青色、水和状態ではピンク色を示 す。したがって、試料の乾燥・給水状態は、 試料の色で識別することができる。

図3に、無水物ならびに水和錯体の吸収ス ペクトルを示す。上段は、真空中で試料を1 日放置した後に測定した、塩化コバルトの NEXAFS スペクトルである(青)。試料は、鮮 やかな青色を呈しており、無水状態(CoCl₂) であることが確認できる。無水状態では、塩 化コバルトは2価の価数を持ち、八面体構造 (0_n対称性)をとることが知られている。本 測定でも同様の原子価・結晶構造を持つ酸化 コバルト(II)などと良く類似した吸収スペ クトルが得られており、過去の報告と整合し た結果が得られた[3]。

下段は、大気圧環境下で測定した、吸水し た状態の塩化コバルト(CoCl2・6H20)の吸収ス ペクトルである(赤)。測定においては、水 試料の乾燥を防ぐために水を混ぜたヘリウ ムガスを測定槽に導入することで吸収スペ クトルを得た。水和状態にある試料の測定で は、無水状態にある試料と比較して、XANES スペクトルに大きな変化が見られる。過去の X 線回折実験により、水和した塩化コバルト 結晶は、CoCl₂・4H₂0の構造をとり、D_{4h}の対 処性を持つ事が報告されている[4]。残りの 2つの水分子は、CoCl₂・4H₂0の外側で水素結 合により配置していると言われている。そこ で、CTM4XAS コード[5]を用いて、水和した塩 化コバルトが D₄ 対称性を持つと仮定したス ペクトル解析を行った。計算の結果を図4に 示す。図には、無水状態の試料について得ら れたスペクトルの解析結果についても合わ せて示している。計算の結果、10Dp/dt/dsの パラメータを、それぞれ 1.25eV, 0.7eV, 0.9eV と過程することで、実験結果を良く再 現できた。これらの解析の結果、水和した試 料ではコバルトに4つの水分子が配位し、D4h 対称性へと変化していることが確認された。



図3:(赤)大気圧環境で吸水した状態、(緑) 低真空下で3分間乾燥した状態、(青)真空中 で1日放置した後に測定した、シリカゲル中 の塩化コバルト(II)の NEXAFS スペクトル。乾 燥に伴ってスペクトルが変化している。吸着 した水が脱水することで、塩化コバルトが無 水物へと変化していると考えられる。



また、水和試料の測定終了後、ヘリウムの 導入を停止した後3分間が経過した際に測 定したスペクトルを中段に示す(図3:緑)。 得られたスペクトルな中段に示す(図3:緑)。 得られたスペクトルの和となっており、ヘリウム導 入を停止したことによって試料が次第に乾 燥し、コバルトの化学状態が変化しているこ とが分かる。この測定により、水環境下にあ る試料において反応が進行している途中段 階を、軟X線吸収分光法により捉えることに 成功した。本課題によって実施した一連の研 究により、軟X線吸収分光法を大気圧環境下 でも利用可能であることが実証され、今後は 触媒化学・生体試料などへと広く応用利用を 展開してゆく道筋をつけることができた。

	研究者番号:
<pre>文献 [1] Y. Tamenori, J. Synchrotron Rad., 17, 243-249 (2010), [2] 柳瀬悦也、他、応用物理、65巻1267-1270 (1996年) [3] F M F de Groot et al., J. Phys. Condens. Matter 5, 2277-2288 (1993) [4] K. Waizumi et al., Bull. Chem. Soc. Jpn, 63, 3426-3466 (1990) [5] E. Stavitski, Micron, 41, 687-694 (2010)</pre>	(3)連携研究者 () 研究者番号:
5. 主な発表論文等 (研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)	
〔雑誌論文〕(計 0件) なし	
 〔学会発表〕(計4件) ① 為則雄祐、2keV以下の軟X線領域における、大気圧環境下軟X線吸収分光測定法の開発、第5回分子科学討論会、2011年9月22日、札幌 ② 為則雄祐、2keV以下の軟X線領域における、転換電子収量法を用いた大気圧軟X線吸収分光測定、第23回放射光学会年会・合同シンポジウム、2011年1月9日、つくば ③ 為則雄祐、軟X線吸収分光法の最前線 - 実環境における高分解能・高感度・局所分析を目指して一、2010年度日本地球化学会年会、2010年9月7日、熊谷 ④ 為則雄祐、SPring-8-BL27SU での軟X線吸収分光測定の現状、第13回 XAFS 討論会、2010年9月4日、草津 	
[その他] なし	
 6.研究組織 (1)研究代表者 為則 雄祐 (TAMENORI YUSUKE) 財団法人高輝度光科学研究センター・ 利用研究促進部門・副主幹研究員 研究者番号:10360819 	
(2)研究分担者 ()	